



V СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС
МЕТРОЛОГИЯ
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГОВ**
Посвящается 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева

ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 19 по 21 мая 2009 года в Москве, в павильоне №55 Всероссийского Выставочного Центра (ВВЦ) успешно состоялись 5-ая Специализированная выставка-конкурс средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования «Метрология-2009» и первый Всероссийский Симпозиум метрологов, приуроченных к Международному Дню метрологии.



«Метрология-2009» – крупнейшее специализированное мероприятие в области метрологического обеспечения высокого качества, надежности и безопасности готовой продукции, организованное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) при поддержке ряда международных и правительственных организаций: ВРМ, OIML, EUROMET, Соомет, Аппарат Правительства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг России), Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука), Федеральное космическое агентство (Роскосмос).



Несмотря на спад в индустриальном секторе российской и мировой экономики, выставка смогла показать значительное увеличение: экспозиционной площади с 2500 до 3000 м², количества участников – с 108 до 143 уч., посетителей – с 3922 до 5098 чел., что подчеркивает значимость данного мероприятия для высокотехнологичных отраслей промышленности России.

Трехдневную работу мероприятия освещали представители 32 специализированных средств массовой информации.





Ростехрегулирование активно взаимодействует по целому ряду проектов с профильными министерствами, федеральными агентствами, государственными корпорациями, что напрямую способствовало развертыванию на выставке коллективных экспозиций Метрологической службы Министерства обороны РФ, Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО), Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).



Ростехрегулирование было представлено двумя коллективными экспозициями подведомственных организаций: 12 региональных ЦСМ и 10 метрологических институтов.



Таким образом, организаторам удалось на одной площадке собрать воедино крупнейших производителей, потребителей, разработчиков, держателей эталонов и регулирующих органов, что является уникальным результатом.

Одной из приоритетных задач Дирекции мероприятия является привлечение российских и иностранных участников и посетителей.

В мероприятиях 2009 года приняли участие 143 организации из 8 стран мира (России, США, Японии, Германии, Италии, Австрии, Белоруссии и Украины).

Среди посетителей выставки – более 5.000 специалистов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций, конструкторских бюро и представителей делового бизнеса из России, СНГ и дальнего зарубежья (Япония, Китай, Болгария, Польша, Албания, Латвия, Египет, Сирия и Ливия).



По результатам обязательной регистрации была сформирована статистика количественного распределения, специализации и области интересов посетителей мероприятия:

Профессиональная принадлежность посетителей:

Начальник отдела метрологии Главный метролог Контролер-метролог	31%
Начальник испытательной лаборатории Начальник лаборатории аналитической химии Начальник передвижной лаборатории Начальник сертификационного и испытательного центра	21%
Начальник производства Начальник отдела комплектации Начальник цеха Технолог Слесарь по КИПиА	17%
Руководитель предприятия Директор по качеству Технический директор Менеджер по закупкам КИПиА	15%
Начальник проектного отдела Инженер Конструктор	9%
Руководитель научно-исследовательской лаборатории Научный сотрудник	5%
Сотрудники специальных служб (МО, ФСБ, МВД, МЧС)	2%

Отраслевая принадлежность посетителей:

Авиакосмический комплекс	19%
Энергетика	11%
Машиностроение	10%
Радиоэлектронная промышленность и Связь	9%
Химическая промышленность	9%
Нефтегазовая отрасль	8%
Строительство	6%
ВПК и Оборонный комплекс	6%
Наука и Образование	5%
Металлургия	4%
Наземный, воздушный и морской транспорт	4%
ЖКХ	4%
Нанотехнологии	2%
Медицина	2%
Представители министерств, агентств и ведомств	1%

Региональное распределение посетителей:

Москва и Московская обл.	63%
Центральный округ	16%
Северо-Западный округ	7%
Приволжский округ	4%
Уральский округ	3%
Сибирский округ	3%
Зарубежные гости	2%
Дальневосточный округ	1%
Южный округ	1%

Участники выставки продемонстрировали новейшие инновационные разработки средств измерений для всех отраслей промышленности, диагностического оборудования, средств неразрушающего контроля, испытательные стенды, системы учета и контроля, высокоточные промышленные станки, измерительные комплексы для сферы нанотехнологий, средства измерений двойного назначения, аналитические приборы, лабораторное оборудование и медицинские измерительные комплексы.



9 мая на торжественной церемонии открытия мероприятия с приветственными обращениями и пожеланиями к участникам и гостям выступили: Зам. Руководителя Ростехрегулирования В.Н. Крутиков, Советник Генерального директора Государственной корпорации «Росатом» Н.А. Обысов, Руководитель сертификационного центра Государственной корпорации «РОСНАНО» В.В. Иванов, И.О. Начальника метрологической службы МО РФ С.В. Стрелов, Нач. управления метрологии Ростехрегулиро-

вания В.М. Лахов, Генеральный директор компании «Вэстстрой Экспо» И.Г. Зимин.



Из приветственного обращения Председателя оргкомитета выставки «Метрология-2009» В.Н. Крутикова: «Уважаемые коллеги, открытие выставки совпадает с целым рядом знаменательных дат: 20 мая весь мир празднует Международный день метрологии, а мы также отмечаем 175-летие со дня рождения Д.И.Менделеева – не только великого химика, но и метролога. Именно он заложил основы метрологического обеспечения для такой громадной страны как Россия. В-третьих, в этом году вступает в силу основной закон об обеспечении единства измерений».



Из приветственного обращения И.О. Начальника метрологической службы МО РФ С.В. Стрелова: «Выставка – это не только встречи, это обмен опытом, мнениями, идеями, технологиями, конкретными техническими решениями – которые позволяют реализовать творческий потенциал Ваших коллективов. По техническому решению наша выставка не уступает прошедшему недавно в Москве конкурсу Евровидение».

Из приветственного обращения Руководителя сертификационного центра Государственной корпорации «РОСНАНО» В.В. Иванова: «Дорогие коллеги, от имени корпорации РОСНАНО хочу пожелать всем удачи, огромных

результатов участникам выставки в совместных разработках для метрологии и нанометрологии, которым корпорация уделяет огромное внимание».



Из приветственного обращения Советника Генерального директора, главного метролога Государственной корпорации «Росатом» Н.А. Обысова: «Выживать человеку в этом техногенном мире позволяет именно метрология. Атомная отрасль внесла свой вклад в осложнение мира человек и метрологическая служба Росатома делает всё, чтобы человек не только выживал, но и процветал. Желаю всем для этой цели на выставке наладить межотраслевые контакты».



Одной из главных задач Оргкомитета в 2009 году являлось проведение технической выставки и научно-деловой программы в едином формате.

В рамках выставки 19 и 20 мая состоялся первый в новейшей истории нашего государства Всероссийский симпозиум метрологов, посвященный 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева – выдающегося русского ученого, инициатора и руководителя работ по созданию поверочных учреждений в России. 32 доклада по наиболее актуальным вопросам в области метрологии, стандартизации и сертификации представили на открытое обсуждение крупнейшие участники выставки и специально приглашен-

ные гости из Международного бюро мер и весов (BIPM), Международного комитета законодательной метрологии (OIML), Госстандартов Белоруссии, Казахстана и Украины, Метрологической Академии РФ и др.



Президиум первого Всероссийского симпозиума метрологов возглавили: Начальник Управления метрологии Ростехрегулирования В.М. Лахов, Зам. Председателя Международного бюро мер и весов Л.К. Исаев, Советник Генерального директора Государственной корпорации «Росатом» Н.А. Обысов, Зам. Генерального директора ФГУ «Ростест-Москва» А.С. Евдокимов и ведущий программы Зам. Директора по науке ФГУП «ВНИИМС» В.Ю. Иванов.

Были зачитаны приветственные обращения к участникам симпозиума от Директора Международного бюро мер и весов (BIPM) Э.Дж. Волларда, Зам. Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации И.В. Боровкова, Руководителя Ростехрегулирования Г.И. Элькина, Генерального директора Государственной корпорации «РОСНАНО» А.Б. Чубайса, Генерального директора Государственной корпорации «Росатом» С.В. Кириенко.



К присутствующим на открытии пленарного заседания симпозиума обратился Начальник Управления метрологии Ростехрегулирования В.М. Лахов: «От лица Министерства промышлен-

ленности и торговли, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, поздравляю Вас с наступающей датой Всемирного дня метрологии. Появление этого праздника подтверждает огромное значение метрологии во всех областях жизни человечества. Девиз нашего симпозиума – Метрология в поддержку экономического развития, является более чем актуальным».

Особое внимание метрологов вызвал доклад Л.К. Исаева о 10-летию подписания Международной Договоренности CIPM MRA, которая является одним из ключевых документов о мировом признании достоверности измерений.

В завершающий день работы выставки состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 2009 года Всероссийской выставочно-конкурсная программа «За единство измерений», которая проходит на базе экспертных комиссий ФГУ «Ростест-Москва» и 32 ГНИИ МО РФ.



Основная цель конкурса – аттестация приборов и оборудования, относящихся к различным средствам измерений, диагностики, испытаний или аналитики, на соответствие их высоким метрологическим характеристикам и качеству.

В награждении лауреатов приняли участие: Председатель конкурсной комиссии, Нач. управления метрологии Ростехрегулирования В.М. Лахов, Председатель экспертной комиссии, Зам. генерального директора ФГУ «Ростест-Москва» А.С. Евдокимов, Сопредседатель экспертной комиссии, Зам. Начальника 32 ГНИИ МО РФ В.В. Швыдун, Зам.председателя конкурсной комиссии Н.П. Муравская, Зам. Председателя оргкомитета выставки И.Г. Зимин, Директор выставки А.Б. Пучков.



Общее количество приборов и оборудования различного назначения, представленного конкурсной комиссией, составило более 200 наименований от 90 компаний. По результатам коллегиального решения конкурсная комиссия подвела следующие итоги: Знак Качества по одной из пяти номинаций был присужден 62 средствам измерений от 32 компаний, Золотой медалью выставки «Метрология» были удостоены 46 продемонстрированных на выставке приборов и 15 компаний за представленные экспозиции. Платиновая медаль «Средства измерений двойного назначения» присуждена 8 приборам гражданского и военного назначения от 6 компаний.



На церемонии награждения участников конкурсной программы Председатель экспертной комиссии, Зам. генерального директора ФГУ «Ростест-Москва» А.С. Евдокимов сказал: «Благодаря нашей выставке, мы понимаем, что метрология живет и будет жить. Мы видим – производители метрологического обеспечения у нас есть и наши средства измерений, испытательное и лабораторное оборудование ничем не хуже, а даже лучше, чему свидетельствуют выданные Знаки Качества и Медали».



С фотогалереей, организационным комитетом, списком участников, итоговой программой симпозиума и реестром лауреатов конкурса можно ознакомиться на сайте мероприятия: <http://metrol.expoprom.ru>

Сопредседатель экспертной комиссии, Зам. Начальника 32 ГНИИИ МО РФ В.В. Швыдун подчеркнул: «В этом году Оргкомитет выставки нашел возможным в рамках данного мероприятия предусмотреть новую номинацию, которой награждаются средства измерений и разработки двойного назначения с целью их продвижения на внутреннем и внешних рынках».



Результаты конкурсной программы 2009 года занесены в официальный реестр ФГУ «Ростест-Москва» и доступны потребителям для свободного ознакомления на сайтах экспертных комиссий, выставки «Метрология» и публикуются в СМИ.

В заключительном слове Нач. управления метрологии Ростехрегулирования В.М. Лахов подвел итоги мероприятия: «Несмотря на кризисную ситуацию, выставка удалась и по отношению к прошлому году мы видим примерно на 30% большее количество участников, представленных экспонатов, посетителей. Всё это внушает оптимизм, что метрология займет достойное место в стране и внесет свой вклад в выход из кризиса и последующее развитие. С праздником Вас, спасибо за участие и уверен, в следующем году нас будет больше!».